신기술
입자복합특성장치

특허등록번호
10-1360891

특허명
입자복합특성측정장치

대표발명자
대외협력실 강상우

나노 사이즈의 입자 측정은 물론 성분과 형상까지 모두 측정하는 기술

반도체 디스플레이는 물론 입자와 관련된 모든 산업계 제품의 생산량과 수익성을 쑥쑥 높여줄 KRISS의 기술을 소개합니다.
바로 나노 사이즈의 입자 측정은 물론 성분과 형상까지 모두 측정해내는 KRISS 강상우 박사의 '입자 복합특성 측정장치' 기술인데요. 공정상의 입자 측정 진행 시 문제점을 실시간으로 진단해주고 샘플링 방식을 이용하여 어느 위치에서든 정교한 측정을 이루어 내는 기술입니다.
'입자 복합특성 측정장치'에 대해 궁금한 점이 있으시거나 이와 관련한 상담을 원하시는 분은 언제든지 KRISS 기술이전센터로 문의해 주세요!